



ポータブルな多種センサ搭載スキャナーによる 現地測定サービス

さまざまなセンサを組み合わせることで測定量の2次元分布を可視化いたします。

技術の特長

複数の直動スライダの走査と信号採取をコンピュータで一元的に行い、さまざまな測定量(変位、振動等)の2次元分布を効率的に可視化いたします。

汎用走査装置

- 代表的な仕様
 - ・ 測定範囲: X300mm × Y300mm × Z150mm※
 - ・ 測定ピッチ: 0.05mm~(任意に設定可能)
 - ・ 走査速度: ~100mm/s
- スライダ交換により、対象ワークに合わせて測定できます。
- センサを交換するだけで、ほぼ同様のソフトウェア操作で、種々の測定量の分布を計測できます。
- お客様の現場に持ち込めますので、以下のような対象の測定値分布の可視化が可能です。
 - ・ 運搬の難しい(大きい、重い)物品
 - ・ 外部に出せない試作品
 - ・ 状態が変わってしまう半製品

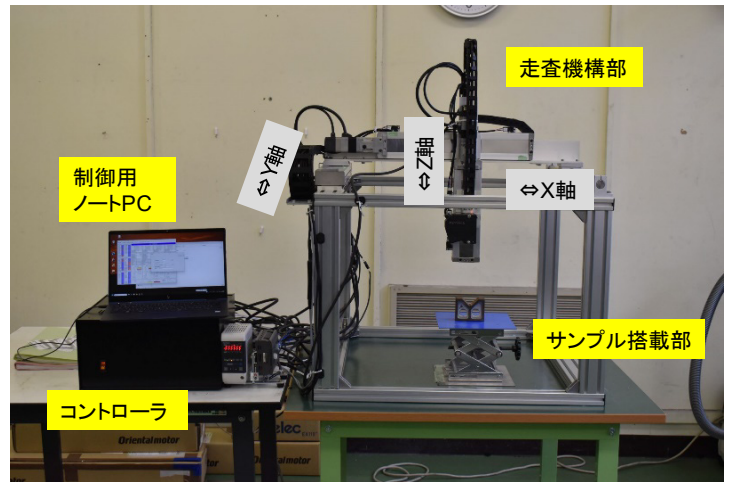


図1 汎用走査装置(社内デモ機;標準構成)

測定例

- レーザ変位計との組み合わせ:
対象の3次元形状を詳細に取得可能
図2の測定ピッチ:0.05mm
- その他、測定可能項目とセンサ
 - ・ 振動場: レーザドップラ振動計
 - ・ 磁場分布: ガウスメータ等
 - ・ 電磁放射: 電界センサ

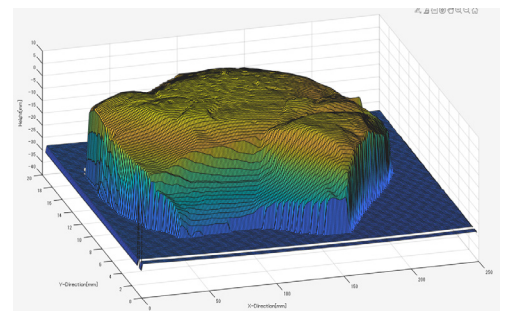
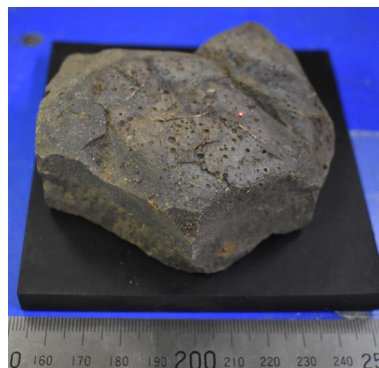


図2 変位分布(3次元形状)測定例 左:外観、右:測定データ(鳥観図)

測定対象

- 自由曲面を持つ物体...金型、樹脂成型品など
- 電子基板等の加振試験中の挙動可視化...振動が顕著な部位の特定など
- センサを接触させると挙動が変わる小型ワーク(電子部品の端子、など)



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2026 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。

